AIN 光導波路型波長変換デバイスのための入力グレーティング結合器

Input Grating Coupler for AIN Optical Waveguide Wavelength Conversion Device

阪大院工¹, 三重大院工², 三重大院地域イノベ³ ^O森岡 佳紀¹, 山口 修平¹, 正直 花奈子², 林 侑介³, 三宅 秀人^{2,3}, 塩見 圭史¹, 藤原 康文¹, 上向井 正裕¹, 片山 竜二¹ Grad. School of Eng., Osaka Univ.¹, Grad. School of Eng., Mie Univ.², RIS, Mie Univ.³ ^OY. Morioka¹, S. Yamaguchi¹, K. Shojiki², Y. Hayashi³, H. Miyake^{2,3}, K. Shiomi¹, Y. Fujiwara¹, M. Uemukai¹ and R. Katayama¹ E-mail: morioka.y@qoe.eei.eng.osaka-u.ac.jp

AIN は強誘電体に匹敵する光学非線形性を有し、波長変換デバイスへ応用可能である。これまで 我々は深紫外光発生用 AIN 極性反転積層チャネル導波路第2高調波発生(SHG)デバイスの設計につ いて報告した[1]。しかし、その導波路断面は1.0×0.3 µm²程度と微小であり、端面結合によるレーザ光入 射は非常に困難である。光導波路型グレーティング結合器(GC)を用いれば、入力結合効率は低下する ものの、その開口の大きさ(約 0.3 mm 角)から導波路端面結合に比べ入射ビームの位置合わせが格段 に容易となる。本研究では、AIN スラブ導波路にレーザ光を結合させる入力 GC の設計と試作を行った。

GC、テーパ型導波路、波長変換チャネル導波路で構成されるデバイスを図 1 に示す。GC に照射された平行ビーム (波長 λ = 532 nm)は収束円筒波に波面変換され、テーパ 型導波路を伝搬しながらチャネル導波路入射端に集光される。GC開口をDPSSレーザのビーム径に等しい0.32 mm × 0.32 mmとし、収束導波光のビームウエストがチャネル導 波路導波モード電界振幅の 1/e 全幅に一致するよう、導波 路内焦点距離をr = 0.73 mmとした。入射平行光と収束導 波光の GC 面上における位相分布の差より、GC の m 番目 ラインの形状式は、図 1 に示す座標を用いて

 $yk_0 \sin \theta - Nk_0 \sqrt{x^2 + (y - r)^2} = 2m\pi + const.$ と表される。ここで N は GC 領域の実効屈折率、 $k_0 = 2\pi/\lambda$ である。入射角を θ =30°とすると、グレーティング周期は 359 nm となる。GC 溝深さ d を決定するため、厚さ 0.30 µm の AlN プレーナ導波路における GC の、放射損失係数と 入力結合効率の溝深さ依存性を計算し、図 3 中の曲線で 示す。d = 28 nm のとき η_{in} の最大値は 29%となり、これは 端面結合効率 72%と比べ低いものの、効率 20%まで位置 ずれを許容したとき、その許容幅 0.5 µm から 200 µm まで 大幅に拡大することがわかった。

次に AIN GC の放射損失係数の溝深さ依存性を実験的 に調べるため、一対の直線 GC (図 2)を EB 描画と Cl₂ ガス を用いた ICP-RIE により AIN プレーナ導波路上に作製し た。入力 GC に入射角 30°でレーザ光を照射すると導波 光が励振され、出力 GC から出射光が得られた。出射光近 視野像より導波光減衰係数を見積もったところ、溝深さが 深くなるにつれ理論値より大幅に増加した(図 3 赤点)。こ れはグレーティング側面荒れによる散乱損失の影響だと考 えられる。また試作した集光型 GC の SEM 写真を図 4 に 示す。光学特性については当日報告する。

謝辞:科研費 16H06415、17H01063、17H05335 の助成及 び大阪大学フォトニクスセンターに感謝申し上げます。

- [1] 山口他、応物秋季講演会,7p-A301-4 (2017).
- [2] T. Suhara and H. Nishihara, IEEE J. Quantum Electron., 22, 845 (1986).



Fig. 1 AlN optical waveguide wavelength conversion device with input GC.



Fig. 2 Linear GCs for in- and out-coupling.







Fig. 4 SEM images of AlN focusing GC.